

# DFM A/S Prislister 2017

Gyldig fra 9. marts 2017



DFM

Danmarks Nationale Metrologiinstitut

Varenr.	Akkrediteret	Beskrivelse	Enhed	2017 Salgspris [DKK]
<b>DC elektrisk kalibrering</b>				
K02.001	JA	Kalibrering af spændingsreferencenormal (Zener)	STK	17195,00
K02.005	JA	Kalibrering af elektrisk modstand 10 kΩ referencenormal, 0,2 ppm	STK	7475,00
K02.006	JA	Kalibrering af elektrisk modstand 1 Ω - 10 kΩ, én resistans	STK	5605,00
K02.007	JA	Kalibrering af elektrisk modstand 1 Ω - 10 kΩ, per efterfølgende resistans	STK	3115,00
K02.999	Kontakt DFM	Elektrisk måling/kalibrering ifølge tilbud.	STK	
<b>Ledningsevnekalibrering</b>				
K03.001	JA	Karakterisering af opløsning ved 24°C-26°C	STK	5260,00
K03.002	JA	Efterfølgende måling på samme opløsning ved 24°C-26°C	STK	3585,00
K03.003	Nej	Karakterisering af opløsning ved 24°C-26°C uden certifikat	STK	4090,00
K03.004	JA	Karakterisering af opløsning ved 15-35°C	STK	6635,00
K03.005	Nej	Karakterisering af opløsning ved 10°C-60°C	STK	6820,00
K03.099	Kontakt DFM	Karakterisering af opløsning ifølge tilbud	STK	
<b>Kalibrering af ledningsevneceller og -målesystemer</b>				
K03.101	JA	Kalibrering af ledningsevnesensor cellekonstant eller ledningsevnemålesystem, per målepunkt, mindst 3 pkt.	STK	3035,00
K03.102	JA	Kalibrering af sensor i CRM væsker ved 10 mS/m, 100 mS/m og 1 S/m i forbindelse med ledningsevnesensorkalibrering, per målepunkt, incl. CRM	STK	6445,00
K03.199	Kontakt DFM	Kalibrering af ledningsevnesensor cellekonstant eller ledningsevnemålesystem ifølge tilbud	STK	
<b>Referenceelektrodekalibrering</b>				
K03.201	JA	Bestemmelse af elektrokemisk referenceelektrodepotential	STK	6875,00
<b>Længdekalibrering</b>				
K04.001	JA	Måleklodskalibrering, første måleklods (1 klods)	STK	2050,00
K04.002	JA	Måleklodskalibrering, flg. 8 klodser (2-9) i samme sæt, pr. klods	STK	585,00
K04.003	JA	Måleklodskalibrering, pr. klods (10-) i samme sæt	STK	305,00
K04.004	JA	Kalibrering af måleklodser, M10 standard sæt	STK	7040,00
K04.005	JA	Kalibrering af måleklodser, M122 standard sæt	STK	41320,00
K04.999	Kontakt DFM	Kalibrering af måleklodser ifølge tilbud	STK	
<b>Optisk radiometri kalibrering</b>				
K05.001	JA	Kalibrering af detektor / powermeter ved ét effektniveau og én bølgelængde, synligt lys	STK	5555,00
K05.002	JA	Kalib. af detektor / powermeter, pr. flg. effektniveau eller bølgelængde, synligt lys	STK	3470,00
K05.020	JA	Kalibrering af detektor / powermeter ved ét effektniveau og én bølgelængde, NIR, 0.7 %	STK	4445,00

# DFM A/S Prislister 2017

Gyldig fra 9. marts 2017



DFM

Danmarks Nationale Metrologiinstitut

K05.021	JA	Kalibrering af detektor/powermeter, pr. følgende effektniveau eller bølgelængde, NIR, 0.7 %	STK	2775,00
K05.022	JA	Kalibrering af detektor / powermeter, ét effektniveau og én bølgelængde, NIR, 1.5 %	STK	2775,00
K05.023	JA	Kalibrering af detektor / powermeter, pr. flg. effektniveau eller bølgelængde, NIR, 1.5 %	STK	1870,00
K05.024	JA	Høj-effekt kalibrering af detektor/powermeter ved ét effektniveau og én bølgelængde, NIR	STK	4700,00
K05.040	Kontakt DFM	Spektralkalibrering af detektor/power meter 800 -1650 nm, pris fra	STK	10415,00
K05.041	JA	Linearitet af detektor/powermeter, -40 dBm til -5 dBm	STK	4165,00
K05.042	JA	Linearitet af detektor/powermeter, -60 dBm til -40 dBm	STK	835,00
K05.043	JA	Linearitet af detektor/powermeter, -5 dBm til +10 dBm	STK	835,00
K05.044	JA	Linearitet af detektor/power meter, -5 dBm til +23 dBm	STK	1390,00
K05.060	JA	Kalibrering af fiberoptisk attenuator, én bølgelængde	STK	3120,00
K05.070	Nej	Homogenitet af detektorer	STK	3900,00
K05.071	Nej	Kalibrering af udstyr til måling af laserstrålers diameter	STK	4435,00
K05.072	Nej	Klassificering af laser pr. bølgelængde	STK	4315,00
K05.080	JA	Kalibrering af optisk spektrumanalysator el. laserbølgelængde, ét måleområde	STK	4130,00
K05.081	JA	Kalibrering af optisk spektrumanalysator el. laserbølgelængde, to måleområder	STK	5270,00
K05.082	JA	Kalibrering af bølgemeter eller laserbølgelængde	STK	5400,00
K05.100	Nej	OTDR afstandskalibrering, SM, første måling ved én bølgelængde	STK	3485,00
K05.101	Nej	OTDR afstandskalibrering, SM, efterflg. måling eller bølgelængde	STK	1320,00
K05.099	Kontakt DFM	Kalibrering af detektor/powermeter synligt lys ifølge tilbud	STK	
K05.999	Kontakt DFM	Radiometrisk måling / kalibrering, ifølge tilbud	STK	

## Massekalibrering

K06.001	JA	Kalibrering pr. lod ved 3 eller flere lodder	STK	970,00
K06.003	JA	Kalibrering af 1 eller 2 lodder	STK	2660,00
K06.999	Kontakt DFM	Kalibrering af lodder ifølge tilbud	STK	

## Mikro- og nanometerskala kalibrering

K07.001	JA	AFM kalibrering af todimensionalt gitter, første gitter	STK	4925,00
K07.002	JA	AFM kalibrering af todimensionalt gitter, følgende gitter, pr. stk.	STK	3800,00
K07.003	JA	AFM kalibrering af stephøjde	STK	4705,00
K07.101	Nej	Ruhedsmåling, billede & rå data. Måling på ét sted, første sted, første billede & første prøve	STK	3130,00
K07.102	Nej	Ruhedsmåling, billede & rå data. Samme session, efterfølgende prøver, første billede	STK	1510,00
K07.103	Nej	Ruhedsmåling, samme prøve, efterfølgende billeder	STK	1045,00
K07.104	Nej	Ruhedsmåling inkl. rapport. Måling på ét sted, første billede	STK	5570,00
K07.105	Nej	Ruhedsmåling inkl. rapport. Samme session, efterfølgende prøver, første billede	STK	2435,00
K07.106	Nej	Ruhedsmåling inkl. rapport. Samme prøve, efterfølgende billeder	STK	1625,00
K07.107	Nej	Long range scan 500 µm x 500 µm x 6 µm inkl. rapport	STK	11085,00
K07.120	Nej	Kalibrering af optisk graticule (mikroplet normal, 8 mikropletter*), 1 µm - 50 µm; *Ved andet antal dots, kontakt os for tilbud	STK	11085,00
K07.140	Nej	Udmåling af lokalt overfladepotentiale (Kelvin Probe Mikroskopi)	STK	3105,00
K07.141	Nej	Udmåling af lokalt overfladepotentiale (Kelvin Probe Mikroskopi), inkl. rapport	STK	5540,00

## Mikro- og nanometerskala kalibrering, overfladeundersøgelser

K07.201	Nej	Overfladeundersøgelser i væske, billede & rå data. Måling på ét sted i væskecelle, første billede	STK	4290,00
---------	-----	---	-----	---------

# DFM A/S Prislister 2017

Gyldig fra 9. marts 2017



DFM

Danmarks Nationale Metrologiinstitut

K07.202	Nej	Overfladeundersøgelser i væske, billede & rå data. Samme session, efterfølgende prøver, første billede	STK	2090,00
K07.203	Nej	Overfladeundersøgelser i væske, billede & rå data. Samme prøve, efterfølgende billeder	STK	1275,00
K07.204	Nej	Overfladeundersøgelser i væske inkl. rapport. Måling på ét sted i væskecelle, første billede	STK	6730,00
K07.205	Nej	Overfladeundersøgelser i væske inkl. rapport. Samme session, efterfølgende prøver, første billede	STK	3130,00
K07.206	Nej	Overfladeundersøgelser i væske, inkl. rapport. Samme prøve, efterfølgende billeder	STK	1855,00
K07.301	Nej	Brug af AFM facilitet (for erfarne brugere), excl. konsulentbistand, første dag	STK	2435,00
K07.302	Nej	Brug af AFM facilitet (for erfarne brugere), excl. konsulentbistand, efterfølgende dage, pr. dag	STK	1275,00
K07.303	Nej	Overfladeundersøgelser af eller sammen med videnskabelig medarbejder (inkl. rapportering). Tid registreres pr. påbegyndt 1/2 time. Pris er pr. time	TIME	1510,00
K07.999	Kontakt DFM	Udmåling af overflader, ifølge tilbud	STK	

## Mikro- og nanometerskala kalibrering, interferens- og konfokalmikroskopi

K07.304	Kontakt DFM	Måling med interferens- og konfokal-mikroskop, ifølge tilbud	STK	
K07.305	Nej	Karakterisering af silicium liniegitre (liniebredde (CD), højde samt vinkel af sidevæg), ifølge tilbud	STK	
K07.306	Nej	Ruhedsmåling med konfokal/interferens-mikroskop, første sted, måling og prøve	STK	2350,00
K07.307	Nej	Ruhedsmåling med konfokal/interferens-mikroskop, følgende sted eller måling, samme session/prøve	STK	960,00
K07.308	JA	Kalibrering af stephøjde med konfokal/interferens-mikroskop, første sted, måling og prøve	STK	3705,00
K07.309	JA	Kalibrering af stephøjde med konfokal/interferens-mikroskop, følgende sted eller måling, samme session/prøve	STK	3150,00
K07.310	JA	Lateral kalibrering af 2-dim. gitter med konfokal/interferens-mikroskop, første sted, måling og prøve	STK	3880,00
K07.311	JA	Lateral kalibrering af 2-dim. gitter med konfokal/interferens-mikroskop, følgende sted eller måling, samme session/prøve	STK	2995,00

## Mikro- og nanometerskala kalibrering, andet

K07.399	NA	Specialspidser til AFM, ifølge tilbud	STK	
K07.401	Nej	Elipsometrisk måling af filmtykkelse/ optiske konstanter i ét punkt	STK	2770,00
K07.402	Nej	Elipsometrisk måling af filmtykkelse/ optiske konstanter i flere punkter ifølge tilbud	STK	
K07.501	Nej	Replikering af overflader med polymeraftryk, ifølge tilbud	STK	
K07.998	Kontakt DFM	Måling af Youngs Modulus, ifølge tilbud	STK	
K07.999	Kontakt DFM	Udmåling af overflader, ifølge tilbud	STK	

## Akustisk kalibrering

K08.001	JA	Mikrofon, tryk, reciprocitet, LS1	STK	10755,00
K08.002	JA	Mikrofon, tryk, reciprocitet, LS2	STK	10755,00
K08.003	JA	Mikrofon, fritfelt, reciprocitet, LS1	STK	18020,00
K08.004	JA	Mikrofon, fritfelt, reciprocitet, LS2	STK	21500,00
K08.005	JA	Mikrofon, fritfelt sammenligning (LS1, LS2, WS1 eller WS1)	STK	5375,00
K08.006	JA	Mikrofon, fritfelt sammenligning (som K08.005, grundydelse)	STK	2990,00
K08.007	JA	Som K08.006, flg. mikrofon pr. stk., samme målesession	STK	2495,00
K08.008	JA	Mikrofon, tryk sammenligning (LS1, LS2, WS1 og WS1)	STK	5375,00

# DFM A/S Prislister 2017

Gyldig fra 9. marts 2017



DFM

Danmarks Nationale Metrologiinstitut

K08.009	JA	Mikrofon, tryk sammenligning (som K08.008, grundydelse)	STK	3500,00
K08.010	JA	Mikrofon, HF-kalibrering, fritfelt reciprocitet WS3	STK	21500,00
K08.011	JA	Mikrofon, HF-kalibrering, fritfelt sammenligning WS3	STK	6325,00
K08.012	JA	Mikrofon, HF-kalibrering (som K08.011, grundydelse)	STK	4300,00
K08.201	JA	Aktuatorrespons (LS1, LS2, WS1 og WS1)	STK	1980,00
K08.202	JA	Aktuatorrespons, (LS1, LS2, WS1 og WS1), grundydelse	STK	1250,00
K08.203	JA	Aktuatorrespons, HF til 100 kHz	STK	2750,00
K08.204	JA	Aktuatorrespons, HF til 100 kHz, grundydelse	STK	1950,00
K08.205	JA	Kalibrering af pistonfon	STK	3150,00
K08.206	JA	Kalibrering af lydkalibrator (én frekvens)	STK	2845,00
K08.207	JA	Kalibrering af lydkalibrator (én frekvens), grundydelse	STK	2150,00
K08.301	JA	Øresimulator, kalibrering jvf. IEC 60318-1, IEC 60318-4	STK	5700,00
K08.101	Nej	Yderligere prøvning, mikrofon, egenstøj, iflg. tilbud	STK	
K08.102	Nej	Yderligere prøvning, mikrofon, membraninspektion, iflg. tilbud	STK	
K08.103	Nej	Yderligere prøvning, mikrofon, temp. koefficient, iflg. tilbud	STK	
K08.104	Nej	Yderligere prøvning, mikrofon, koefficient for statisk tryk, iflg. tilbud	STK	
K08.105	Nej	Yderligere prøvning, mikrofon, DC lækagetest, iflg. tilbud	STK	
K08.999	Kontakt DFM	Akustik måling / kalibrering ifølge tilbud	STK	

## Partikel-tællerkalibrering og udmåling af partikler

K09.001	JA	Kalibrering af tælleeffektivitet, én partikel-tæller, ved én partikelstørrelse	STK	3150,00
K09.002	JA	Udvidelse af antal partikelstørrelser i kalibrering, pris per yderligere størrelse, samme målesession	STK	1965,00
K09.003	Nej	Yderligere ISO 21501-4 afprøvninger jf. datablad, pr. tæller	STK	1035,00
K09.004	NA	Rabat ved kalibrering af 2-4 stk	%	
K09.005	NA	Rabat ved kalibrering af 5 stk. eller flere	%	
K09.101	JA	Referencepartikler (100 nm - 5 µm diameter) kalibreret med AFM	STK	5645,00
K09.102	JA	Referencepartikler (100 nm - 5 µm diameter) kalibreret med AFM (kunde leverer selv partikler)	STK	4705,00
K09.103	Nej	Udmåling af partikler (polystyren) kalibreret med lysspredning	STK	3480,00
K09.104	Nej	Udmåling af partikler (polystyren) kalibreret med lysspredning (kunde leverer selv partikler)	STK	2900,00
K09.999	Kontakt DFM	Partikelrelaterede målinger ifølge tilbud	STK	

## Ruhed og koordinatmåling

K11.001	JA	Kalibrering af ruhedsmålere; Parameterkalibrering (1. forst. trin)	STK	5025,00
K11.002	JA	Kalibrering af ruhedsmålere; Forstærkningskalibrering (1. forst. trin)	STK	4465,00
K11.003	JA	Kalibrering af ruhedsmålere; Totalkalibrering (1. forst. trin)	STK	5585,00
K11.004	JA	Kalibrering af ruhedsmålere; Tillæg for efterflg. forstærkningstrin	STK	1675,00
K11.100	JA	Kalibrering af ruhedsnormal; ISO Type C	STK	3910,00
K11.101	JA	Kalibrering af ruhedsnormal; ISO A1 (brede riller, plan bund) 2 riller	STK	3910,00
K11.102	JA	Kalibrering af ruhedsnormal; ISO A2 (brede riller, afrundet bund) 6 riller	STK	12840,00
K11.103	JA	Kalibrering af ruhedsnormal; ISO B2 (riller med enkelt form)	STK	3910,00
K11.108	JA	Kalibrering af ruhedsnormal; ISO D (profiler med uregelmæssig form, én retning)	STK	5025,00
K11.201	JA	Kalibrering af optomekanisk hulplade, prøvningsrapport, én position	STK	4060,00
K11.202	JA	Kalibrering af hulplade efter DKD retningslinier	STK	12130,00
K11.999	Kontakt DFM	Prøvning af ruhed, ifølge tilbud	STK	



## Ledningsevnerferenceopløsninger

R03.001	JA	Referenceopløsning, 0,5 liter KCl i H <sub>2</sub> O, 0,01 S/m	STK	3410,00
R03.002	JA	Referenceopløsning, 0,5 liter KCl i H <sub>2</sub> O, 0,1 S/m	STK	3410,00
R03.003	JA	Referenceopløsning, 0,5 liter KCl i H <sub>2</sub> O, 1,0 S/m	STK	3410,00
R03.004	JA	Referenceopløsning, 0,5 liter KCl i H <sub>2</sub> O, 10 S/m	STK	3410,00
R03.999	Kontakt DFM	Referenceopløsning, batch fremstillet på bestilling, ifølge tilbud	STK	

## pH referenceopløsninger

R03.101	JA	Primær pH-buffer 'Ftalat' (pH=4.005)	STK	35975,00
R03.102	JA	Primær pH-buffer '1:1 fosfat' (pH = 6.865)	STK	35975,00
R03.103	JA	Primær pH-buffer '1:3.5 fosfat' (pH = 7.413)	STK	35975,00
R03.104	JA	Primær pH-buffer 'Borat' (pH = 9.180)	STK	35975,00
R03.105	JA	Primær pH-buffer 'Karbonat' (pH = 10.012)	STK	35975,00
R03.106	JA	Sekundær pH-buffer '1:4 fosfat' (pH = 7.38)	STK	35975,00

## Bølgelængdereferencer

R05.001	NA	Absorptionscelle, inkl. vinduer og ventil	STK	3095,00
R05.002	NA	Absorptionscelle med 12C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> (op til 101,3 kPa)	STK	5425,00
R05.003	NA	Absorptionscelle med 12CO (op til 101,3 kPa)	STK	5425,00
R05.004	NA	Absorptionscelle med 12CO <sub>2</sub> (op til 101,3 kPa)	STK	5425,00
R05.005	NA	Absorptionscelle med 12CH <sub>4</sub> (op til 101,3 kPa)	STK	5425,00
R05.006	NA	Absorptionscelle med NH <sub>3</sub> (op til 101,3 kPa)	STK	5425,00
R05.007	NA	Absorptionscelle med H <sub>2</sub> S (op til 101,3 kPa)	STK	5425,00
R05.008	NA	Absorptionscelle med 13C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> (op til 101,3 kPa)	STK	6190,00
R05.009	NA	Absorptionscelle med 13CO (op til 101,3 kPa)	STK	6190,00
R05.010	NA	Absorptionscelle med 12C <sub>18</sub> O (op til 40,0 kPa)	STK	7745,00
R05.011	NA	Holder til absorptionscelle	STK	3870,00
R05.012	NA	Holder til absorptionscelle og GRIN linser (inkl. to linser, monteret og linet op)	STK	14670,00
R05.013	NA	Montering af LED med SM fiber og FC/PC stik (ekskl. materialer)	STK	1795,00
R05.014	NA	LED monteret på Peltier køler og køleribber	STK	6190,00
R05.015	NA	Aluminiumskabinet m. stik for optiske fibre og elektriske forbindelser	STK	6190,00

## DFM Software

S01.003	NA	DFM Calibration Datasheet 2000 til MS Excel, iflg. tilbud	STK	
S08.002	NA	Akustikprogram MP.EXE, version 4, ifølge tilbud	STK	
S08.003	NA	Opgradering til MP.EXE, version 4, ifølge tilbud	STK	

## Konsulentydelse

YDE1	NA	Konsulentydelse, Seniorforsker	TIME	1525,00
YDE2	NA	Konsulentydelse, Forsker	TIME	1220,00
YDE3	NA	Konsulentydelse, Tekniker	TIME	915,00

# DFM A/S Prislise 2017

Gyldig fra 9. marts 2017



**DFM**

Danmarks Nationale Metrologiinstitut

---

Priser er gældende fra den angivne dato indtil nye udsendes. Aktuelle priser findes til enhver tid på <http://www.dfm.dk>.  
Ydelser udover de nævnte standardydelser faktureres til timepris efter aftale.  
Priser er ab DFM, og er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl.